

Contrastes en microscopie électronique : quels paramètres pour quelles images

INSCRIPTIONS (GRATUITE MAIS OBLIGATOIRE)

- **Pour les agents CNRS de la délégation Alpes (DR11) uniquement**, inscription en ligne : <https://cas.cnrs.fr/cas/login?service=https%3A%2F%2Fjanus.cnrs.fr%2Ffidp%2FAuthn%2FRemoteUser>
Attention : l'application janus sera inaccessible du jeudi 29 juin 18h au vendredi 7 juillet
- **Pour tous les autres participants (autres délégations ou autres tutelles)** :
Remplir la [fiche d'inscription](#) et l'adresser à fp@dr11.cnrs.fr

Programme :

| | |
|---------------|---|
| 9h00 - 9h30 | Accueil des participants |
| 9h30 - 10h00 | Mot d'accueil de Anne Imberty (CERMAV), de Sylvain Cottaz (ICMG) et de France Simonet (RéCaMiA) |
| 10h00 - 10h45 | Quel contraste avec quel détecteur en MEB Frédéric Charlot – Grenoble |
| 10h45 - 11h30 | Le contraste en MET: champ clair / champ sombre, HR, EELS, HAADF Muriel Veron – Grenoble |
| 11h30 - 12h00 | Le contraste des polymères en MET Pierre Alcouffe – Lyon |
| 12h00 - 13h30 | <i>Déjeuner</i> |
| 13h30 - 14h00 | ECCI: Electron Channeling Contrast Imaging Nabila Maloufi – Metz |
| 14h00 - 14h30 | "Phase plate", le contraste de la matière molle en MET Régis Ravelle-Chapuis – JEOL |
| 14h30 - 15h00 | Le contraste à basse tension / haute tension en MEB Michel Trentin – FEI |
| 15h00 - 15h30 | <i>Pause</i> |
| 15h30 - 16h00 | Le contraste en WET-STEM Karine Masenelli-Varlot – Lyon |
| 16h00 - 16h30 | Les détecteurs in-lens Thierry Grenut – ELEXIENCE |
| 16h30 - 17h00 | Echanges, questions et clôture de la journée |